

学振 175 委員会 信頼性・システム技術分科会主催
第 6 回 信頼性・システム技術研究会 開催のお知らせ

2013 年 1 月 15 日
信頼性・システム技術分科会 幹事

学振 175 委員会 会員各位,

下記日程にて、第 6 回 信頼性・システム技術研究会を開催する運びとなりました。
今回も信頼性や故障検出、故障診断を中心に、講師の方々から幅広く情報提供いただき、皆様と一緒に PV の維持管理方法や太陽電池モジュールの信頼性について議論したいと思います。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

日時:2013 年 2 月 13 日(水) 13 時~17 時 30 分
場所:東京工業大学 蔵前会館 (1 階 ロイヤルブルーホール)
<http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/index.html>

参加費:無料

参加資格:

学振 175 委員会 委員, 委員代理, および委員の所属する組織において信頼性・システム技術に携わる方

* 1:同一組織から複数名の参加を認めます

* 2:学界委員には交通費を支給します(希望者のみ。代理の場合は支給できません。)

参加申込先:下記のリンク先から登録ください。

<http://staff.aist.go.jp/takashi.oozeki/gakushin175.html>

上手く登録できないときは 分科会幹事まで。

ueda.y.ae@m.titech.ac.jp (東工大 植田)

申込締切り:2 月 8 日(金)

スケジュール(予定):

- 13:00～13:05(5分) 分科会委員長挨拶
- 13:05～13:30(25分) 前回までのまとめと本日の講演について(幹事)
- 13:30～14:00(30分) 「高信頼性太陽電池モジュール開発・評価コンソーシアム」および産総研における信頼性に関する取り組みについて(仮題)(産総研, 増田様)
- 14:00～14:25(25分) Bypass diode の熱暴走について(JET, 内田様)
- 14:25～14:45(20分) 休憩
- 14:45～15:10(25分) 太陽光発電システム向けPF管の開発について(仮題)(古河電工, 西山様)
- 15:10～15:35(25分) 太陽光発電の絶縁抵抗試験、耐圧試験について(仮題)(関電工、酒井様)
- 15:35～16:05(30分) Arc Fault: それは25年という時間軸でも安全か(E-T-A, 江角様)
- 16:05～16:30(25分) ブリーダ抵抗を用いた太陽電池アレイ故障診断について(吉富電気, 吉富様)
- 14:30～14:40(10分) 休憩
- 16:40～17:25(45分) 全体討論
指定討論者: 各講師, 朱宮裕次様(ダフレクス)
- 17:25～17:30(5分) まとめ, 事務連絡

本分科会は太陽電池モジュール・太陽光発電システムの信頼性に焦点を当て、研究会などを通じて調査・研究の最新動向や関連情報の共有化を推進する事を目的としております。委員の皆様に加え、システム技術や信頼性に携わる方のご参加を歓迎いたします。

以上